

# 有機EL素子の電極/有機層界面の状態評価

不活性ガス雰囲気下で前処理からXPS測定まで行います

測定法 : XPS・雰囲気制御下での処理

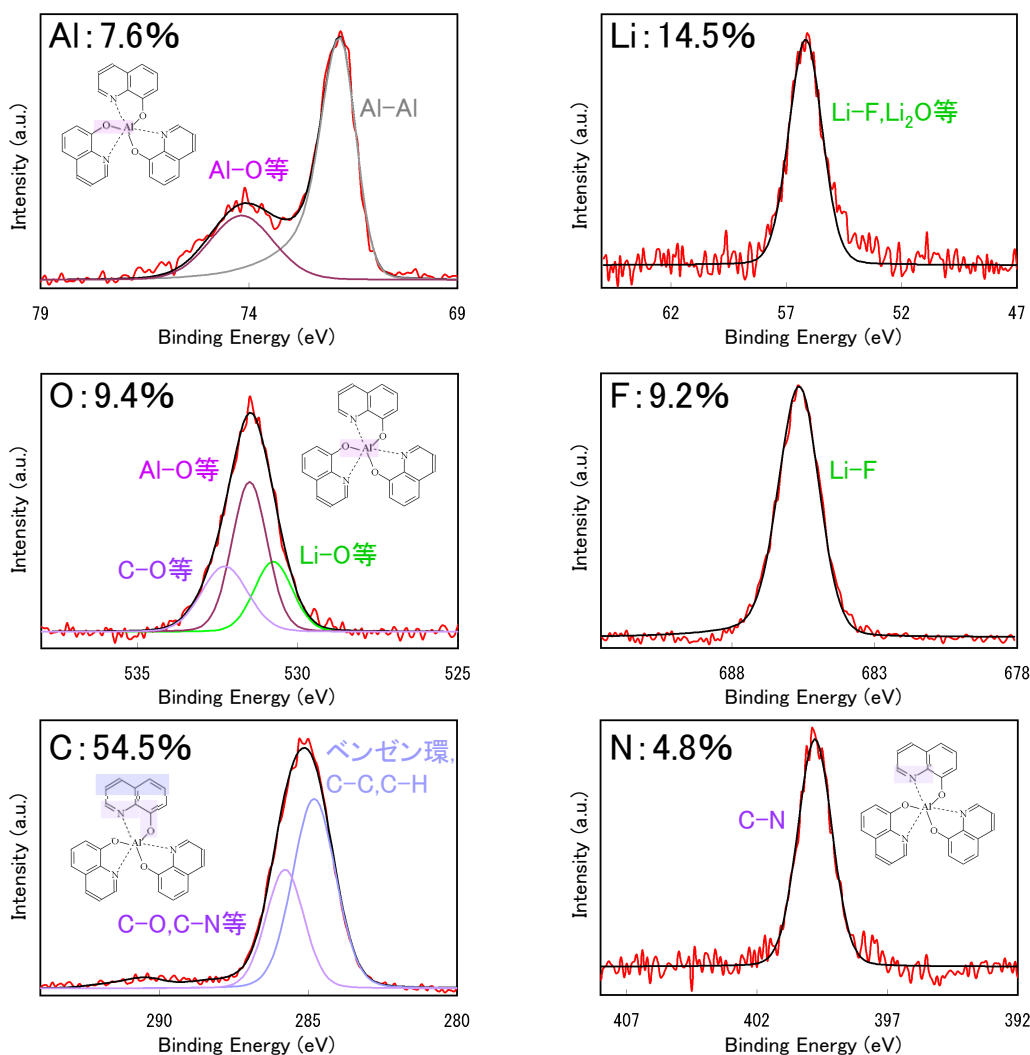
製品分野 : ディスプレイ

分析目的 : 化学結合状態評価

## 概要

バッファ層/Alq3界面を物理的に剥離(ピーリング)し、剥離面(バッファ層側)のXPS分析を行いました。不活性ガス雰囲気下でピーリングすることで化学構造を破壊せずに界面を露出でき、さらに不活性ガス雰囲気を保ったままXPS装置に搬入することで剥離後の変質(酸化・吸湿など)を抑えました。バッファ層の主成分はLiFで、その一部が酸化している可能性が示唆されました。雰囲気を制御することで、成膜方法・処理方法・有機層の違い等によるAl, Li等金属元素の酸化状態を評価することが可能です。

## データ



不活性ガス雰囲気下でピーリングを行ったAl電極/バッファ層/Alq3界面のXPS分析結果

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート!

一般財団法人  
**MIST** 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp

URL : <https://www.mst.or.jp/>